

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-294220

(43) 公開日 平成7年(1995)11月10日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

G 0 1 B 11/06

識別記号

G

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平6-89517

(22) 出願日 平成6年(1994)4月27日

(71) 出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72) 発明者 工藤 重樹

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三

菱化成株式会社総合研究所内

(72) 発明者 野村 一雄

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三

菱化成株式会社総合研究所内

(72) 発明者 成合 正憲

神奈川県茅ヶ崎市円蔵370番地 三菱化成

株式会社茅ヶ崎事業所内

(74) 代理人 弁理士 小林 将高

(54) 【発明の名称】 多層薄膜の膜厚検出方法および装置

(57) 【要約】

【目的】 多層薄膜の膜厚検出を高速、かつ高精度に検出可能とする。

【構成】 試料10に白色光源1から白色光を光ファイバ2を介して照射し、試料10より反射した光を光ファイバ3を介して分光器4に入射させて分光し、そのスペクトルを高速フーリエ変換してエネルギースペクトルをマルチチャネルディテクタ5から得た後、信号処理器7で信号処理して多層薄膜の膜厚を得る構成を特徴としている。

